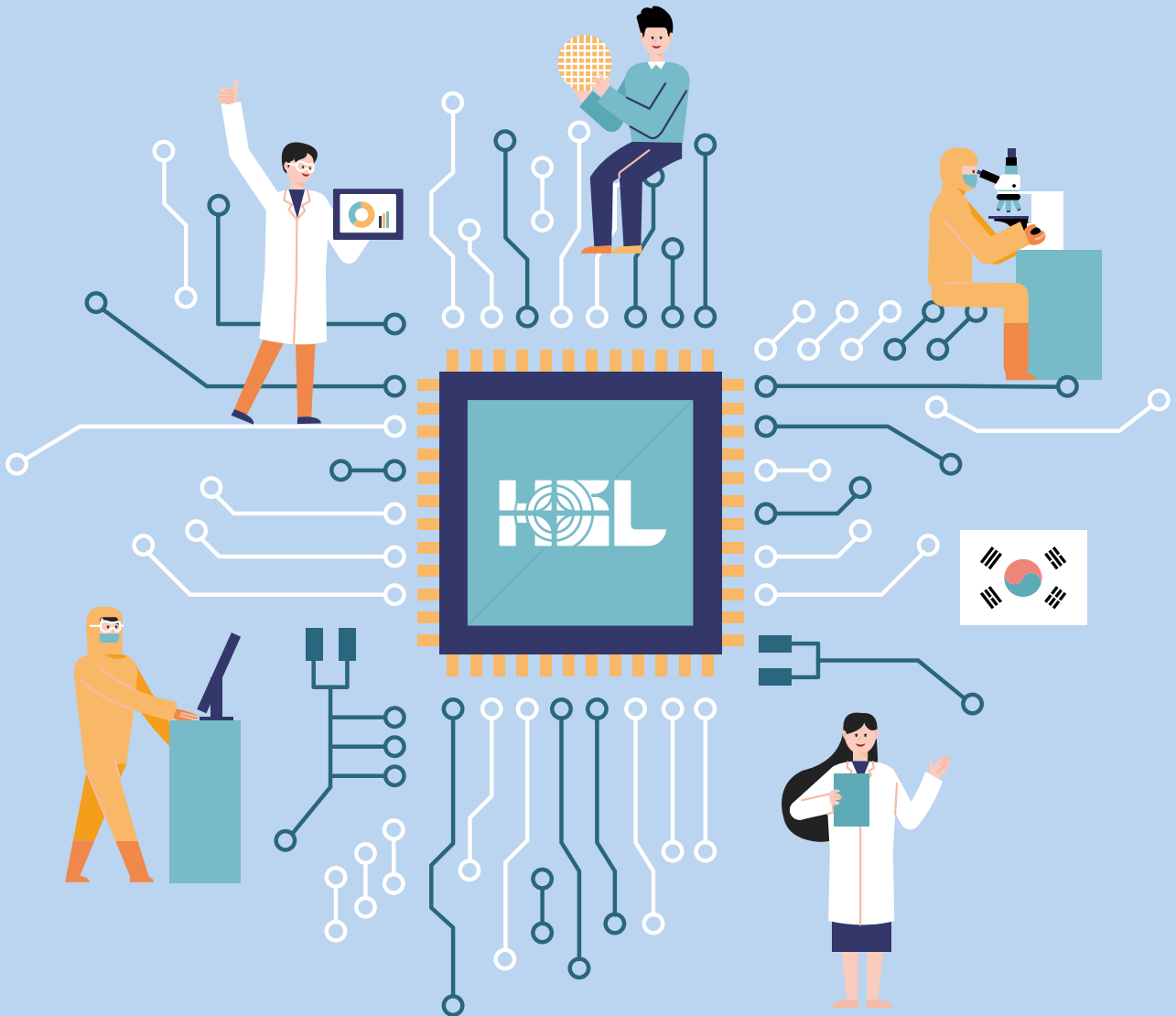




# 기업을 돕는 기업 한국센서연구소 공인(일반)성적서 시험/인증 서비스





## 한국센서연구소는 반도체 및 센서 KOLAS 국제공인 시험기관입니다.

| 표준구분           | 표준명                                                                                                                                                                                                                                                  | 출처                                                         | 적용              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 국내표준(TTA)      | 정보통신용 저항기의 주기적 전압 펄스에 의한 저항값의 변화량 평가 방법                                                                                                                                                                                                              | 한국정보통신기술협회(TTA)                                            | 반도체 소자 및 칩 & 센서 |
| 국내표준(TTA)      | 반도체 소자의 1/f 잡음평가 방법                                                                                                                                                                                                                                  | 한국정보통신기술협회(TTA)                                            |                 |
| 국제표준(ISO)      | Steady-State Temperature-Humidity Bias Life Test                                                                                                                                                                                                     | Global Standards for the Microelectronics Industry (JEDEC) | 반도체 소자 및 칩 & 센서 |
| 국제표준(ISO)      | High Temperature Storage Life                                                                                                                                                                                                                        | Global Standards for the Microelectronics Industry (JEDEC) | 반도체 소자 및 칩 & 센서 |
| 국제표준(ISO)      | Low Temperature Storage Life                                                                                                                                                                                                                         | Global Standards for the Microelectronics Industry (JEDEC) |                 |
| 국제표준(ISO)      | Temperature Cycling                                                                                                                                                                                                                                  | Global Standards for the Microelectronics Industry (JEDEC) | 반도체 소자 및 칩      |
| 국제표준(ISO)      | Temperature, Bias, and Operating Life                                                                                                                                                                                                                | Global Standards for the Microelectronics Industry (JEDEC) | 반도체 소자 및 칩      |
| 미국방성 (MIL-STD) | Department of Defense Test Method Standard<br>ENVIRONMENTAL ENGINEERING<br>CONSIDERATIONS AND LABORATORY TESTS<br>PART TWO - LABORATORY TEST METHODS<br>501.4 High Temperature<br>502.4 Low Temperature<br>503.4 Temperature Shock<br>507.4 Humidity | Military Standard,<br>Department of Defense<br>(U.S.A.)    | 반도체 소자 및 칩 & 센서 |
| 미국방성 (MIL-STD) | Department of Defense Test Method Standard<br>ENVIRONMENTAL ENGINEERING<br>CONSIDERATIONS AND LABORATORY TESTS<br>PART TWO - LABORATORY TEST METHODS<br>501.7 High Temperature<br>502.7 Low Temperature<br>503.7 Temperature Shock<br>507.6 Humidity | Military Standard,<br>Department of Defense<br>(U.S.A.)    | 반도체 소자 및 칩 & 센서 |
| 미국방성 (MIL-STD) | Department of Defense Test Method Standard<br>ENVIRONMENTAL ENGINEERING<br>CONSIDERATIONS AND LABORATORY TESTS<br>PART TWO - LABORATORY TEST METHODS<br>501.5 High Temperature<br>502.5 Low Temperature<br>503.5 Temperature Shock<br>507.5 Humidity | Military Standard,<br>Department of Defense<br>(U.S.A.)    | 반도체 소자 및 칩 & 센서 |
| 국내표준(KS)       | 환경 시험 - 제2-1부: 시험 - 시험 A: 내한성 시험                                                                                                                                                                                                                     | 한국표준협회                                                     | 반도체 소자 및 칩 & 센서 |
| 국제표준(IEC)      | Environmental testing - Part 2-1: Tests - Test A: Cold                                                                                                                                                                                               | International Electrotechnical Commission (IEC)            |                 |
| 국내표준(KS)       | 환경 시험 - 제2-2부: 시험 - 시험 B: 내열성 시험                                                                                                                                                                                                                     | 한국표준협회                                                     |                 |
| 국제표준(IEC)      | Environmental testing - Part 2-2: Tests - Test B: Dry heat                                                                                                                                                                                           | International Electrotechnical Commission (IEC)            |                 |
| 국내표준(KS)       | 환경 시험 - 제 2-30부: 시험 - 시험 Db와 지침: 내습 사이클(12+12-h 사이클)                                                                                                                                                                                                 | 한국표준협회                                                     | 반도체 소자 및 칩 & 센서 |
| 국제표준(IEC)      | Environmental testing - Part 2-30: Tests - Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle)                                                                                                                                                            | International Electrotechnical Commission (IEC)            |                 |
| 국내표준(KS)       | 환경 시험 - 제2-38부: 시험 - 시험 Z/AD: 합성 온도/습도 사이클 시험                                                                                                                                                                                                        | 한국표준협회                                                     |                 |
| 국제표준(IEC)      | Environmental Testing - Part 2-38: Tests - Test Z/AD: Composite temperature/humidity cyclic test                                                                                                                                                     | International Electrotechnical Commission (IEC)            |                 |
| 국내표준(KS)       | 환경 시험 - 제2-78부: 시험 -시험 Cab: 안정 상태의 내습성 시험                                                                                                                                                                                                            | 한국표준협회                                                     |                 |
| 국제표준(IEC)      | Environmental testing - Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat, steady state                                                                                                                                                                         | International Electrotechnical Commission (IEC)            |                 |
| 국내표준(KS)       | 환경 시험 방법(전기·전자) - 안정상태의 내습성 시험, 부품의 가속시험에 적용                                                                                                                                                                                                         | 한국표준협회                                                     |                 |
| 국제표준(IEC)      | Environmental testing Part 2: Tests — Test Cy: Damp heat, steady state, accelerated test primarily intended for components                                                                                                                           | International Electrotechnical Commission (IEC)            |                 |

- KOLAS 시험성적서는 상호인정협정(ILAC-MRA)에 가입한 103개 국가의 시험기관과 아시아-태평양 시험기관 인정 협력체 상호인정협정(APLAC-MRA)에 가입한 24개국 39개 시험기관에서 발행한 시험성적서와 동등한 효력을 갖습니다.

# 01 국제공인시험인정 분야

한국센서연구소 1/f Noise 기술은 세계최강입니다.

| 표준구분           | 표준명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 출처                                                         | 적용              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 국제표준(ISO)      | Procedure for Measuring N-Channel MOSFET Hot-Carrier-Induced Degradation Under DC Stress                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Global Standards for the Microelectronics Industry (JEDEC) | 반도체 소자 및 칩      |
| 국제표준(ISO)      | Procedure for Measuring P-Channel MOSFET Negative Bias Temperature Instabilities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Global Standards for the Microelectronics Industry (JEDEC) | 반도체 소자 및 칩      |
| 국제표준(ISO)      | Procedure for Characterizing Time-Dependent Dielectric Breakdown of Ultra-Thin Gate Dielectrics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Global Standards for the Microelectronics Industry (JEDEC) | 반도체 소자 및 칩      |
| 국내표준(TTA)      | Evaluation method of bolometer film for infrared sensor: Part 1. Temperature Coefficient of Resistance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 한국정보통신기술협회(TTA)                                            | 센서              |
| 국내표준(TTA)      | Evaluation method of bolometer film for infrared sensor: Part 2. 1/f noise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 한국정보통신기술협회(TTA)                                            | 센서              |
| 국제표준(ISO)      | Procedure for Measuring P-Channel MOSFET Hot-Carrier-Induced Degradation Under DC Stress                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Global Standards for the Microelectronics Industry (JEDEC) | 반도체 소자 및 칩      |
| 국제표준(ISO)      | A Procedure for the Evaluation of Low-k/Metal Inter/Intra-Level Dielectric Integrity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Global Standards for the Microelectronics Industry (JEDEC) | 반도체 소자 및 칩      |
| 미국방성 (MIL-STD) | Department of Defense Test Method Standard Transistor Electrical Test Methods for Semiconductor Devices Part 3: Test Methods 3000 Through 3999<br>3001.1 Breakdown Voltage, Collector to Base<br>3005.1 Burnout by Pulsing<br>3011.2 Breakdown Voltage, Collector to Emitter<br>3026.1 Breakdown Voltage, Emitter to Base<br>3051 Safe Operating Area(Continuous DC)<br>3401.1 Breakdown Voltage, Gate-to-Source<br>3403.1 Gate-to-Source Voltage or Current<br>3404 MOSFET Threshold Voltage<br>3405.1 Drain-to-Source On-State Voltage<br>3407.1 Breakdown Voltage, Drain-to-Source<br>3411.1 Gate Reverse Current<br>3413.1 Drain Current<br>3415.1 Drain Reverse Current<br>3421.1 Static Drain-to-Source On-State Resistance | Military Standard, Department of Defense (U.S.A.)          | 반도체 소자 및 칩 & 센서 |
| 미국방성 (MIL-STD) | Department of Defense Test Method Standard Diode Electrical Test Methods for Semiconductor Devices Part 4: Test Methods 4 000 Through 4999<br>4011.4 Forward Voltage(3.2 Pulse method 제외)<br>4016.4 Reverse Current Leakage<br>4021.2 Breakdown Voltage (Diodes)<br>4076.1 Saturation Current<br>4141.1 Burn out By Repetitive Pulsing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Military Standard, Department of Defense (U.S.A.)          | 반도체 소자 및 칩 & 센서 |
| 미국방성 (MIL-STD) | Department of Defense Test Method Standard Electronic and Electrical Component Parts Class 100 Environment Test<br>103B Humidity (steady state)<br>106G Moisture resistance<br>107G Thermal shock<br>108A Life (At Elevated Ambient Temperature)<br>Class 200 Physical-Characteristics Test<br>201A Vibration<br>204D Vibration, High Frequency<br>Class 300: Electrical-Characteristics Tests<br>301 Dielectric Withstanding voltage<br>302 Insulation resistance<br>303A DC resistance<br>304 Resistance temperature characteristic<br>305A Capacitance<br>306 Quality factor<br>307 Contact Resistance<br>309 Voltage coefficient of resistance determination procedure                                                        | Military Standard, Department of Defense (U.S.A.)          | 반도체 소자 및 칩 & 센서 |

## 02 일반성적서시험 분야

한국센서연구소는 수준 높은 시험분석서비스를 제공합니다.

|                 | 분야                           | 세부항목                                    |                                      |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 반도체 시험<br>분석    | 웨이퍼 및 칩<br>레벨 시험 분석          | 저주파노이즈 시험                               | 포화전류 시험                              |
|                 |                              | 신뢰성 스트레스에 따른 저주파노이즈 평가                  | MOSFET 임계전압 시험                       |
|                 |                              | 전압-전류 특성 분석                             | 전자이동도 시험                             |
|                 |                              | 커패시턴스 측정 분석                             | TCC 시험                               |
|                 |                              | Q-Factor 측정 분석                          | TCR 시험                               |
|                 |                              | Impedance 측정 분석                         | Disturb 특성 시험 분석                     |
|                 |                              | Hot Carrier 시험 분석                       | Endurance 특성 시험 분석                   |
|                 |                              | TDDB 신뢰성 시험 분석                          | Retention 특성 시험 분석                   |
|                 |                              | NBTI 신뢰성 시험 분석                          | 전압펄스에 의한 저항값 변화량 측정분석                |
|                 |                              | PBTI 신뢰성 시험 분석                          | 파워 소자의 순방향 전류-전압 특성                  |
|                 |                              | GOI 신뢰성 시험 분석                           | 파워 소자의 역방향 누설 전류 특성                  |
|                 |                              | MTTF 시험                                 | 항복 전압 시험                             |
|                 |                              | SOA 분석 및 개선                             | Gate Charge 측정시험                     |
|                 |                              | EM/SM 시험 분석                             | Back-gate를 이용한 소자 분석                 |
|                 |                              | 게이트 (역)전류 시험                            | Pulsed I-V 측정 분석                     |
|                 |                              | 드레인 (역)전류 시험                            | TTF 시험                               |
|                 |                              | 순방향 전압 시험                               | Warpage 측정                           |
|                 |                              | 역전류 누설 시험                               | 다중 SIF 밴딩 신뢰성 시험                     |
|                 | 환경 및 신뢰성 시험                  | 고온 저장 시험                                | 열충격 시험                               |
|                 |                              | 저온 저장 시험                                | HAST 시험                              |
|                 |                              | 고온 동작 시험                                | 온도 사이클 신뢰성 시험                        |
|                 |                              | 저온 동작 시험                                | 습도 사이클 신뢰성 시험                        |
|                 |                              | 고온 고습 시험                                |                                      |
|                 | TFT소자/Flexible<br>Display 소자 | Bending 시험                              | GOI 등 신뢰성 시험                         |
|                 |                              | Back-gate를 이용한 소자 분석                    | Hall Effect 측정                       |
|                 |                              | 전자이동도 등 주요 파라미터 추출                      |                                      |
| 수준 높은<br>분석 서비스 | 저주파 노이즈<br>시험 구분             | 저주파노이즈(1/f Noise) 측정평가                  | 저주파노이즈 성능개선                          |
|                 |                              | RTS(Random Telegraph Signal) Noise 측정평가 |                                      |
|                 | 고주파 특성<br>평가 분석              | 수동소자 고주파(RF) 영역에서의 측정                   | 반도체 소자의 고주파 특성 측정 및 분석               |
|                 |                              | MOSFET 소자 고주파(RF) 영역에서의 측정              |                                      |
|                 | 메모리 소자<br>특성평가분석             | 메모리 소자 및 제품 특성 평가분석                     | Retention 특성 평가분석                    |
|                 |                              | DRAM 소자 및 제품 특성 평가분석                    | Threshold Voltage의 Endurance 특성 평가분석 |
|                 |                              | Flash Memory 소자 및 제품 특성 평가분석            | Program & Erase cycle에 따른 소자 특성분석    |
|                 |                              | Embedded Memory 소자 및 제품 특성 평가분석         |                                      |
|                 | 소자의 Self-heating<br>평가 분석    | SOI/SOS 소자의 Self-heating 분석평가           | Heterojunction 소자의 Self-heating 분석평가 |
|                 |                              | MOSFET/Power 소자의 Self-heating 분석평가      | 구동전류/Carrier Mobility/Speed 감소 분석평가  |
|                 |                              | High Current 소자의 Self-heating 분석평가      | 소자 신뢰성 특성저하/동작 특성 Modeling 불가능 평가    |
|                 |                              | High Voltage 소자의 Self-heating 분석평가      |                                      |
|                 | 고온 및 저온에서<br>다양한 전기적 특성분석    | 고온에서의 다양한 전기적 특성분석(~200도)               | 저온에서의 다양한 전기적 특성분석                   |
|                 |                              | 온도에 따른 소자 및 센서의 특성변화 분석                 | 온도 감소에 따른 소자 및 센서의 특성변화 분석           |
|                 |                              | 고온에서의 저주파노이즈 특성분석                       | 저온에서의 저주파노이즈 특성분석                    |
|                 | Display 소자의<br>신뢰성평가         | Amorphous TFT, LTFS TFT 소자의 신뢰성평가       | Display 소자의 PBTI 신뢰성평가               |
|                 |                              | OLED 소자, ZnO 소자의 신뢰성평가                  | Display 소자의 Mobile Ion 신뢰성평가         |
|                 |                              | Display 소자의 Hot Carrier 신뢰성평가           | Display 소자의 온도에 따른 특성 변화평가           |
|                 | 고속 신호 분석                     | Nano-second 이하 고속 신호 변화 분석              | Pulse 발생 및 특성 분석                     |
|                 |                              | 타이밍 및 펄스 측정시험                           | 오실로스코프 측정 불가능 영역 측정 분석               |
|                 | 배선의 신뢰성 시험평가                 | EM(Electro Migration) 특성 평가             | SM(Stress Migration) 특성 평가           |
|                 | 불량 분석                        | 반도체 소자의 신뢰성 불량분석                        | Dielectric 특성 분석                     |

한국센서연구소 신뢰성 기술이 반도체 및 센서의 성능을 높여줍니다.

INNOBIZ  
기술혁신형중소기업



| 분야                        | 세부항목                     |
|---------------------------|--------------------------|
| 수준 높은<br>분석 서비스           | 불량 분석                    |
|                           | Gate Oxide의 불량분석         |
|                           | 계면 불량분석                  |
|                           | Silicide 불량분석            |
|                           | Junction Leakage 불량분석    |
|                           | 캐패시터 불량분석                |
|                           | 저항 불량분석                  |
|                           | 인덕터 불량분석                 |
| Test Wafer 및<br>공정 서비스 분야 | Test Wafer<br>제작 서비스     |
|                           | ALD 공정                   |
|                           | Sputter 공정               |
|                           | 산화막 공정                   |
|                           | Furnace/RTP<br>Annealing |
|                           | 고온고압시험                   |
|                           | Photo-lithography<br>공정  |
|                           | 다양한 시험<br>분석 서비스         |
|                           | 반도체 및 전기전자<br>제품 시험 서비스  |
|                           | 다양한 시험<br>분석 서비스         |

한국센서연구소는 'Carbon Net Zero 2050'에 동참하고 있습니다.

|                         | 분야               | 세부항목                             |                                     |
|-------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 반도체 및 전기전자<br>제품 시험 서비스 | 다양한 시험<br>분석 서비스 | 인식율 시험                           | Microstrip Isolator 시험              |
|                         |                  | 표면 구조분석 시험                       |                                     |
| 첨단 센서 시험<br>분석 서비스      | 가스센서 시험 분석       | 톨루엔 가스센서 시험                      | VOCs 가스센서 반응시험                      |
|                         |                  | 화학가스 탐지시험                        | VOCs 가스센서 성능시험                      |
|                         |                  | 일산화탄소 가스센서 시험                    | 환경의존성 시험(온도, 습도 변화)                 |
|                         |                  | 황화수소 가스센서 시험                     | 소비전력 시험                             |
|                         |                  | 암모니아 가스센서 시험                     | 반응속도/반응시간 시험                        |
|                         |                  | 오존 가스센서 시험                       | 회복속도 시험                             |
|                         |                  | 타 가스 선택성 시험                      | 감지범위 시험                             |
|                         |                  | 이산화질소 가스센서 시험                    | 민감도 시험                              |
|                         |                  | 이산화탄소 가스센서 시험                    | 수명 시험                               |
|                         |                  | 메탄 가스센서 시험                       | 동작 온습도 측정시험                         |
|                         |                  | 메탈 가스센서 시험                       | 포름알데히드 가스센서 시험                      |
|                         |                  | 광학식 복합 가스센서 시험                   | 악취 감지 센서의 가스 농도 시험                  |
|                         |                  | 가연성 가스센서 측정시험                    | 저항 변화율 시험                           |
|                         |                  | 반도체식 가스센서 시험                     | 감도시험                                |
|                         |                  | 열전도도방식 가스센서 시험                   | 소비전력 시험                             |
|                         |                  | 가스주입식 가스농도 측정시험                  | 응답속도 시험                             |
|                         |                  | 전기화학식 가스센서 시험                    | 크기측정 시험                             |
|                         |                  | 화학작용제 탐지농도 시험                    | 분해능측정 시험                            |
|                         |                  | MEMS 가스센서 시험                     | 독성 센서 성능 평가                         |
|                         |                  | 에틸렌 가스센서 반응시험                    |                                     |
|                         | 적외선 센서 시험        | IR 카메라 측정                        | 저주파노이즈 측정                           |
|                         |                  | 소모전력 측정                          | 신뢰성 시험                              |
|                         |                  | NEIT 특성 측정                       |                                     |
|                         | 진동 및 압력 센서 시험    | 진동(가속도) 인가 시험                    | 신호대비잡음 평가                           |
|                         |                  | 진공 및 고압 압력 시험                    | 반복성 평가                              |
|                         |                  | 특성분석 및 저항분석                      | 초음파 센서 공간 해상도 측정                    |
|                         |                  | 민감도평가                            | CWDM DEMUX 초점거리 측정 시험               |
|                         |                  | 음향 렌즈 Gain 시험                    |                                     |
|                         | 지문 인식 센서 시험      | 지문 인식카드 성능시험                     | 무전원 지문인식카드 시험                       |
|                         | 바이오 센서 시험        | Shigella spp 30분 이내 양성확인         | 토양센서 토양 습도 시험                       |
|                         |                  | Shigella spp 100 copies/rxn 양성확인 | 생체신호센서 성능 시험                        |
|                         |                  | 비옥도 측정 정확도 시험                    | 식중독균 유전자 통합 판별칩의 성능 시험              |
|                         |                  | 바이러스 센서 성능시험                     | DNA 증폭장치 성능 시험                      |
|                         |                  | 생체신호감지모듈 센서 탐지 거리 시험             | OECT 활성층 소재 성능 시험                   |
|                         | 미세먼지 센서 시험       | 미세먼지 저감율 시험                      | MEMS 미세먼지 센서 시험                     |
|                         |                  | 공기질 측정센서 시험                      | 미세먼지 측정 정밀도 시험                      |
|                         | 온도/습도 센서 시험      | 지하 온도 측정장치 시험                    | 온습도센서의 성능 시험                        |
|                         |                  | 면상발열체 신뢰성 시험                     |                                     |
|                         | 이미지 센서 시험        | 이미지센서 성능시험                       | 구강센서 시험                             |
|                         |                  | 결합촬영장치의 감지 성능시험                  | 색변환 센서 성능 시험                        |
|                         | 지자기 센서 시험        | 3축 지자기센서 시험                      | 펄스 장비 결합탐지율                         |
|                         |                  | 자기장센서 성능 시험                      | 자기센서 결합 검출 정확도 시험                   |
|                         |                  | 금속탐지센서 성능 시험                     | Hall Sensor에 대한 신뢰성 시험 전/후 특성 평가 시험 |
|                         | 가속도 센서 시험        | 가속도 정밀도 시험                       | 3축 인가 시험                            |
|                         |                  | 인가 진동 주파수 측정 시험                  |                                     |
|                         | 차량용 센서 시험        | 차륜센서모듈 신뢰성 평가                    | 차량용 공기 청정기 성능시험                     |
|                         |                  | 차량용 온습도 센서 시험                    |                                     |

한국센서연구소의 스마트한 융합·연결·속도가 명품을 만듭니다.

|                    | 분야              | 세부항목                               |                                                |
|--------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| 첨단 센서 시험<br>분석 서비스 | 항법/관성 센서 시험     | 기울기 센서 정확도 및 신뢰성 평가 시험             | 관성센서 환경 시험                                     |
|                    |                 | IoT 기반의 계측 시스템의 제어 속도 시험           | 관성센서 노이즈 시험                                    |
|                    |                 | 위치 정밀도 시험                          |                                                |
|                    | 근접/감지 센서 시험     | 촉각센서의 신뢰성시험                        | 근접 거리 정밀도 시험                                   |
|                    |                 | 경보 시스템 제품의 반복 신뢰성 시험               |                                                |
|                    | 알코올 센서 시험       | 에탄올 가스 센서 시험                       | 알코올 센서 신뢰성 시험                                  |
|                    |                 | 알코올 농도 정밀도 시험                      |                                                |
|                    | pH 센서 시험        | pH 정밀도 측정시험                        | pH 측정 범위 측정시험                                  |
|                    |                 | Data Sampling 측정시험                 | pH 센서 Drift 특성 시험                              |
|                    | 철분 센서 시험        | 분해능 측정시험                           | 동작온도 측정시험                                      |
|                    |                 | 동작속도 측정시험                          | 반복성 시험                                         |
|                    |                 | 내진동성 측정시험                          |                                                |
|                    | TFT 센서 시험       | 신뢰성 시험                             | 점멸비 시험                                         |
|                    |                 | 이동도 시험                             |                                                |
|                    | 수소 센서 시험        | 센서 감지특성 시험                         | 동작습도 측정시험                                      |
|                    |                 | 신뢰성 시험                             | 동작압력 측정시험                                      |
|                    |                 | 감지범위 측정시험                          | 농도측정 평가시험                                      |
|                    |                 | 정확도 측정시험                           | 타가스 선택성 시험                                     |
|                    |                 | 응답시간 측정시험                          | 환경의존성 시험                                       |
|                    | 불산 센서 시험        | 신뢰성 시험                             | 검출시간 측정시험                                      |
|                    |                 | 검출감도 측정시험                          | 회복시간 측정시험                                      |
|                    | 시스템 속도측정시험      | 센서 모듈 속도측정 시험                      | 센서 장비 속도측정 시험                                  |
|                    | 토크 센서 시험 구분     | 고온특성(동작) 시험                        | 저온특성(동작) 시험                                    |
|                    | NDIR 센서 시험 구분   | 정확도 시험                             | 소모전력 시험                                        |
|                    | 조도/GPS 센서 시험    | 위치 정확도 성능시험                        | 온도분해능/동작율/장파장대역 광반응 시험                         |
|                    |                 | PAR(광합성유효방사) 정확도 성능시험              |                                                |
|                    | 적외선 / 자외선 센서 시험 | UV Sensor 온도 동작 시험                 | 온도 정밀도 시험                                      |
|                    |                 | 마이크로볼로미터의 저주파노이즈 시험                |                                                |
|                    | 모션 센서 시험        | 유연 패키지 벤딩 신뢰성 시험                   | 모션 인식 반복성 시험                                   |
|                    |                 | 모션 인식 정확도 시험                       |                                                |
|                    | 조도 센서 시험        | 정상 광파워 응답특성 측정                     | 4분할 일사센서의 Elevation Angle/Azimuth Angle/FOV 시험 |
|                    |                 | Photo Detector에 대한 Responsivity 시험 |                                                |
|                    | 수질 센서           | 인산염 센서의 성능시험                       |                                                |
|                    | 음향/유량 센서 시험     | R290 감도 시험                         | 순간 최대 출력 밀도 시험                                 |
|                    | CT X-Ray 디텍터 시험 | 고온저장 신뢰성 시험                        | 열충격 신뢰성 시험                                     |
|                    | 풍속/풍력 발전 센서 시험  | 풍속 정밀도 시험                          | 발전 전압 측정 시험                                    |
|                    |                 | 장시간 동작 신뢰성 시험                      |                                                |
| 자문/교육<br>서비스       | 반도체소자 개발 자문     | 반도체 소자 (다양한 요구조건)에 따른 개발 자문        | 다이오드, 캐패시터 등 수동소자 개발 자문                        |
|                    |                 | 아날로그 반도체 개발 자문                     | 인덕터, 저항 등 개발자문                                 |
|                    |                 | 차량용 반도체 개발 자문                      |                                                |
|                    | 센서 개발 자문        | 센서 구조 및 공정 개발 자문                   | MEMS 소자/센서 개발 자문                               |
|                    |                 | 바이오 소자/센서 개발 자문                    | MEMS 소자/센서 성능향상이나 수율향상 자문                      |
|                    |                 | 바이오 소자/센서 성능향상이나 수율향상 자문           |                                                |
|                    | 회로 관련 개발 자문     | 통신 시스템 및 회로 관련 자문                  | 고주파 회로 설계 자문                                   |
|                    |                 | 아날로그 시스템 및 회로 설계 자문                |                                                |
|                    | 교육              | Device Physics 교육                  | 국제 표준화 관련 자문 및 교육                              |
|                    |                 | 반도체 및 센서 신뢰성 교육                    | KOLAS 인정 관련 자문 및 교육                            |

기업을 돕는 기업 한국센서연구소

# 공인(일반)성적서 시험/인증 서비스

## 품질·국제공인시험·안전보건 경영시스템 인증

Quality · KOLAS · Occupational Health and Safety  
Management System Certified Firm

**ISO 9001 / ISO 17025 / ISO 45001**



인간과 기기의 안전한 네트워크  
KOLAS 국제공인시험기관(KT 614)

 **한국센서연구소**  
KOREA SENSOR LAB CO., LTD.

소재지 대전광역시 유성구 대학로 291 6층, 8층 (한국과학기술원 나노종합기술원)  
부속시설 대전광역시 유성구 대학로 99 충남대학교 공대 2호관 273호  
홈페이지 <http://www.ksensor.co.kr>